



## T/270/70/10-25

### TempEvent

Our stress screening test chambers, TempEvent model, feature high rates of temperature change, from 10 to 25 K/min. They are ideal for ageing tests as well as for electrically operated test specimens with high heat loads (e.g. 8000 W at 20 °C) and heavy test specimens (of up to 500 kg). For these challenges, in particular, where standard solutions quickly reach their limits, our temperature and climatic test chambers are designed for rapid thermal cycling tests.

#### datasheet\_headline\_highlights

- 다량의 폐열이 발생하는 AI 및 전자 장비용
- 방위산업 분야의 요구사항
- 귀중한 테스트 재료의 보호
- 효율성과 성능의 조화
- 네트워크 연동. 유연성. 미래에 대비.
- CO<sub>2</sub>를 활용한 친환경 냉각

# datasheet\_headline\_technical-data

T/270/70/10-25

# datasheet\_headline\_options

| datasheet_tablehead_label | datasheet_tablehead_des                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 추가 액세스 포트                 | 스테인리스 스틸로 소재의 액세스 포트는 세 가지 표준 크기(Ø 50, 80, 125 mm)로 제공되며, 실리콘 플러그 1개(폐쇄형)와 폼 + 실리콘 플러그 1개(슬롯형)가 포함되어 있습니다.                                                                                         |
| 시험편 온도 측정                 | 새로운 버전의 IEC 60068-2-14 Nb를 포함한 다수의 규격에서는 시험 단계 동안 시험편의 온도를 면밀히 관찰하고 기록할 것을 요구합니다. 당사의 시험 챔버에는 추가 온도 센서를 장착할 수 있고, 측정값은 디스플레이에 표시되고 기록됩니다(USB 또는 SIMPATI® 활용). 필요에 따라 센서 중 하나를 제어용 센서로 사용할 수도 있습니다. |